

蛍光X線膜厚計

【セイコー電子工業 SEA5120】

【設備の特徴】

試料を前処理なしで、数分程度で手軽に元素分析できる装置です。10cm角程度の比較的大きな試料が挿入可能であることが特徴です。また、メッキ膜など、数ミクロンオーダーの膜厚の測定が可能です。

【設備の仕様概要、技術内容】

■仕様概要

試料ステージ(可動距離)	X: 75mm
	Y: 75mm
	Z: 35mm
検出器	Si半導体検出器
測定スポット径	1.8mmΦ, 0.1mmΦ
検出可能元素	Al ~ U



■効果が期待される利用分野

【活用例】

- ・Au、Ni、Agなどのメッキ膜厚の測定(多層も可)
- ・試料表面の異物の元素分析

【設備の利用について】

詳細については当センターにご相談ください。

【お問い合わせ先】

秋田県産業技術センター

先端機能性素子開発部 千葉 隆

TEL:018-862-3414 / FAX:018-865-3949

〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11 / <http://www.rdc.pref.akita.jp/>